Universitatea "Babes-Bolyai", Facultatea de Fizica, Cluj-Napoca, Romania & Institutul de Cercetari Interdisciplinare in Bio-Nano-Stiinte

EFFECTUL LANTANULUI ASUPRA

MICROSFERELOR TITANOSILICATICE

Rezumatul tezei de doctorat

Awatef Cheniti

Coordonator stiintific: Prof. dr. Simon Simion

Cluj-Napoca, 2012

CUPRINS

INTRODUCERE	5
REZULTATE SI DISCUTII	7
1. Sinteza prin metoda sol gel si uscare prin pulverizare	7
2. Microsfere titanosilicatice nanostructurate, cu continut scazut de lantan	8
2.1 Analize termice	8
2.2 XRD	8
2.3 SEM	10
2.4 FTIR	11
2.5 Raman	12
2.6 EPR	12
2.7 NMR	14
2.8 XPS	15
3. Microparticule titanosilicatice nanostructurate, cu continut ridicat de lantan	17
3.1 XRD	17
3.2 SEM	18
3.3 FTIR	20
3.4 Raman	21
3.5 EPR	22
3.6 NMR	23
3.7 XPS	24
CONCLUZII	26
Bibliografie selectiva	

Cuvinte cheie: sol gel, uscare prin pulverizare, microsfere, pamanturi rare, analize termice, difractie de raze X, microscopie electronica de baleaj, spectroscopie cu fotoelectrini de raze X, rezonanta electronica de spin, rezonanta magnetica nucleara, spectroscopie Raman si IR.

INTRODUCERE

Teza de doctorat se bazeaza pe sinteza prin metoda sol gel combinata cu uscarea prin pulverizare a unor sisteme oxidice de interes stiintific, teoretic si aplicativ. Avand in vedere dezvoltarea spectaculoasa a materialelor oxidice cu continut de pamanturi rare, potentialele aplicatii in domenii cum ar fi fibre optice, laseri, senzori, cat si in domeniul biomaterialelor, in cadrul acestei teze au fost sintetizate si analizate din punct de vedere structural si morfologic materiale titanosilicatice cu continut de lantan.

Sistemele silico-titanate au atras atentia cercetatorilor in special pentru aplicatii ca si catalizatori si suporti catalitici, mai ales ca nanocompozitele silico-titanate au o fotoactivitate mai mare decat cea a titanului pur [1,2]. Adaugarea oxidului de siliciu in materialele pe baza de titan duce la schimbari importante ale proprietatilor, in special la suprafata, incluzand cresterea suprafetei specifice a oxidului de titan [3]. Prin aditia de pamanturile rare (PR) pot fi schimbate proprietatile fizice si chimice ale sistemelor titanosilicatice. Este cunoscut interesul de a inroduce pamanturi rare in materiale cu aplicabilitate in fotocataliza datorita faptului ca se obtine o suprafata imbunatatita a acestor materiale, in sensul dezvoltatii de nanocriatale de dimensiuni mai mici. Aditia de pamanturi rare duce le o intarziere in dezvoltarea nanocristalelor in timpul tratamentelor termice [4]. In cazul incorporarii de ion de lantan in matrici de dioxid de titan se otine la suprafata materilalelor faza cristalina La₂CO₅ care duce la o imbunatatire fotoactivitatii titanului [5,6]. Oxidul de lantan este des utilizat pentru materialele optice, carora le confera densitate scazuta, indice de refractie ridicat, duritate, durabilitate chimica.

Marerialele titanosilicatice cu continut scazut de of La_2O_3 au o multipla utilizabilitate, atat in domeniul optic si cel de fotocataliza, cat si in cel al biomaterilalelor. Desi au fost studiate mai intens din punctul de vedere al proprietatilor fotocatalitice [7-10], materialele titanosilicatice au o dezvoltare promitatoare si in domeniul de biomateriale [11-15]. Oxidul de titan, cat si in cominatie cu cel de siliciu au fost deja utilizate in studii de adeziune si proliferare celulara, si a fost demonstrat faptul ca atat dezvoltatea apatitei cat si atasarea si proliferarea celulelor cresc in cazul suprafetelor din oxizi micsti, TiO₂-SiO₂, comparativ cu TiO₂ pur [16]. De asemena a fost raportat in literatura de specialitate faptul ca lantanul imbunatateste diferentierea osteoblastilor *in vitro*, si nu are nici un efect asupra colagenului de tip I. Lantanul cunoaste un interes major si joaca un rol din ce in ce mai important in gestionarea mai multor boli sistemicein special in domeniul oncologiei [17-21]. De asemenea este cunoscut si efectul panaturilor rare asupra hidofilicitatii filmelor de TiO_2 , atat SiO_2 cat si La₂O₃ demonstrand o imunatatire a acesteia [22].

Teza este structurata pe sapte capitole, dintre care primul il constituie introducerea iar cel de-al saptelea concluziile studiului. Cel de-al doilea capitol trateaza aspecte fundamentale legate de sistemele pe baza de titaniu si siliciu, cat si aplicatiile acestora, subliniindu-se rolul aditiei de pamanturi rare. Tot in acest capitol este discutata natura defectelor retelelor de SiO_2 si TiO_2 , cat si rolul important pe care il au acestea in aplicatii fotocatalitice.

In capitolul al treilea sunt descrise metodele sol gel si de uscare prin pulverizare, cat si motivele pentru care au fost alese pentru sinteza sistemelor investigate. Metodele experimentale utilizate pentru caracterizrea morfologica si structurala a sistemelor sintetizate sunt prezentate pe scurt in capitolul al patrulea: microscopie electronica de balaj, de forta atomica, analiza termice, difracii de raze X, spectroscopie fotoelectronica cu radiatie X, spectroscopie Raman, spectroscopie de rezonanta electronica paramagnetica si de rezonanta magnetica nucleara. In capitolul cinci sunt prezentate echipamentele utilizate pentru sinteza si analiza. Cea mai consistenta parte a acestei teze este capitolul sase, structurat pe trei subcapitole, si cuprinde sinteza si rezultatele experimentale obtinute pentru sistemele investigate. Primul subcapitol este dedicat sintetizei, prin metodele sol gel si uscare prin pulverizare, de microsfere si microparticule apartinand sistemelui Si – Ti – La, atat in domeniul concentratiilor mai mici de lantan, cat si in cel al concentratiilor risicate. Scopul propus in celelalte doua subcapitole este acela de a analiza proprietatile chimice si fizice ale acestor materiale in functie de continutul de lantan, cat si de tratamentele termice aplicate in vederea dezvoltaii de structuri utilizate in apliactiile mentionate anterior.

Resultate & Discutii

1. Microsfere titanosilicatice nanostructurate, cu continut scazut de lantan

Pe baza proprietatilor systemelor titanosilicatice cu continut de pamanturi rare, cat si a multilelor avantaje avantaje pe care le ofera metoda sol gel combinata cu uscarea prin puverizare (materiale cu o mai buna omogenitate, temperatura scazuta pentru preparare, controlarea porozitatii inca din preparare, eficienta productiei imbunatatita, etc.) prezentate detaliat in patrea teoretica a tezei, au fost ales pentru sinteza si analiza sistemul TiO₂-SiO₂-La₂O₃-Gd₂O₃. Au fost astfel sintetizate materiale SiO₂:TiO₂=1:1 (raport atomic) cu continut de xLa₂O₃ (x = 0, 1, 5, 10, 15, 20, 50) dopate cu 1% Gd₂O₃, iar procesul de preparare si materilalele de start utilizate sunt prezentate in Figura 1 si respectiv Tabelul 2. In Tabelul 1 se regasesc detalii despre concentratiile fiecarei probe in parte, domeniile de aplicabilitate, acronimele care vor fi utilizate pe tot pacursul lucrarii, cat si valoarea calculata pentru indicele de refractie, pentru fiecare proba in parte.

1	,			
Concntratia de La ₂ O ₃	Domeniile de aplicabilitate	Codul	Compozitia	Indicele de refractie
	Biomateriale Optica Cataliza	TiSi	0%Gd ₂ O ₃ .100%(50%TiO ₂ +50%SiO ₂ +0%La ₂ O ₃)	n=1.7300
Domeniul de concentratie scazuta de La ₂ O ₃		L0	1%Gd ₂ O ₃ .99%(50%TiO ₂ +50%SiO ₂ +0%La ₂ O ₃)	n=1.7307
		L1	1%Gd ₂ O ₃ .99%(49.5%TiO ₂ +49.5%SiO ₂ +1%La ₂ O ₃)	n=1.7390
		L5	1%Gd ₂ O ₃ .99%(47.5%TiO ₂ +47.5%SiO ₂ +5%La ₂ O ₃)	n=1.7728
		L10	1%Gd ₂ O ₃ .99%(45%TiO ₂ +45%SiO ₂ +10%La ₂ O ₃)	n=1.8138
Domeniul de concentratie ridicata de	Optica Cataliza	L15	1% Gd ₂ O ₃ .99% (42.5% TiO ₂ +42.5% SiO ₂ +15% La ₂ O ₃)	n=1.8554
		L20	1%Gd ₂ O ₃ .99%(40%TiO ₂ +40%SiO ₂ +20%La ₂ O ₃)	n=1.8970
La_2O_3		L50	1%Gd ₂ O ₃ .99%(25%TiO ₂ +25%SiO ₂ +50%La ₂ O ₃)	n=2.1465

Tabel 1.Codul probelor, domeniile de aplicabilitate, compozitiile, indicii de refractie calculati



Tabel 2. Materialele de start utiliza

Materiale	Raportul		
Precursori	Solvent	(%greutate)	
TEOS		1 :2	
TIP	2 mathaniatanal	1 :2	
Gd(NO ₃) ₃ .5H ₂ O	2-metnoxietanoi	1 :10	
$La(NO_3)_3.6H_2O$		1 :10	

Figura 1. Prcesul de preparare al sistemului TiO₂- SiO₂-La₂O₃

2. Microparticule titanosilicatice nanostructurate, cu continut scazut de lantan

(50-x)%TiO₂·(50-x)%SiO₂·x%La₂O₃ (x = 0, 1, 5, 10) – notate in continuare L0, L1, L5, L10.

2.1 Analiza termice

Proprietatile termice ale materiallor preparate au fost studiate prin analize termice (DTA-TGA) in vederea evidetierii temperaturilor la care au loc perderile de masa, descompunerea componentelor organice, eliminarea nitratilor, respectiv la care procesul de



cristalizare este maxim si au loc tranzitiile de faza. Pe baza curbelor DTA au fost stabilite temperaturile de tratament termic necesare obtinerii de materiale amorfe fara reziduri datorate precursorilor, cat si materiale oxidice policristaline: 350, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 and 1200°C. In Figura 2 sunt prezentate analizele DTA-TGA ale probei L0 ca si exemplu.

2.2 XRD

Difractogramele de raze X pentru probele netratate si pentru cele tratate termic la temperatura de 350°C pun in evidenta structura amorfa caracterizata prin picul de difractie larg caracteristic, dintre $2\theta \sim 20^{\circ}$ and 30° (Figurile 3). Acest pic este mult mai larg si creste in intensitate pentru microsferele tratate termic la temperatura de 350°C sugerand ca un alt tip de aranjament exista in interiorul starii amorfe care apare din cauza cresterii temperaturii.

Proba L0 isi pastreaza caracterul amorf pana la temperatura de 800°C, in timp ce probele cu continut mai scazut de lantan (L0, L1, L5) dezvolta faze cristaline la acest tratament termic. Mai mult decat atat, probele L0 and L1 prezinta nanocristale de TiO_2 – anatase (21-1272) [23] inca de la tratamentul termic la 700°C.

Odata cu cresterea temperaturii de tratament termic se evidentiaza in difractogramele de raze X (Figura 3) dezvoltarea primelor faze cristaline de anatas (in cazul probelor L0 si L2) si rutile (21-1276) (in cazul probei L5). Din difractogramele probei L10 se observa dezvoltarea simultane a fazelor de anatase si rutile la temperatura de tratament termic de 900°C. La temperaturi de tratament termic mai ridicate se observa o crestere a fazei de rutile pentru probele L0, L1 si L5, in timp ce pntru proba L10 aceasta faza se diminueaza. Un aspect

notabil il confera prezenta fazei de anatas pentru proba L1 pana la temperatura de tratament de 1100°C, rezultat care este confirmat si de analizele de spectroscopie Raman care vor fi prezentate ulterior (Figura 9). Pe langa faza de anatase se dezvolta dupa tratamentul termic la 1100°C o noua faza, La₄Ti₉O₂₄ (83-0946), faza care este identificata si in probele cu concentratie mai mare de lantan (L5 and L10) inca de la o temperatura de 1000°C.

In cazul probelor cu continut de lantan (L1, L5 si L10) se observa si prezenta nancristalelor specifice fazei La_2O_3 (22-0369) dupa tratamente termice ridicate. Odata cu cresterea cantitatii de lantan (L5 and L10) se dezvolta nanocristale de SiO₂ (coesite) (46-1045) de 25-35 nm ca dimensiune, cat si o faza cristalina $La_xTi_yO_z$, neindexata in baza de date (JCPDS).



Figura 3. Difractogramele XRD ale probelor L0, L1, L5 si L10.

2.3 SEM

Dupa cum se observa in Figura 4, probele preparate prin metoda sol gel sunt particulele bine definite si au forma sferica cu diametrul mai mic de 5 μ m, cu o suprafata neteda, fara pori vizibili la suprafata.

In aczul microsferelor cu continut mai ridicat de lantan (L10) se observa faptul ca peretii sunt deformati din cauza ciocnirilor dintre microsfere in timpul uscarii prin pulverizare, cat si datorita coliziunii microsferelor cu peretii ciclonului. Odata cu cresterea concentratiei de lantan peretii microsferelor sunt mai putin rigizi si in consecinta mai usor de distorsionat.



Figura 4. Imagini SEM ale probelor L0, L1, L5 si L10.

Microscopia electronica de baleaj (SEM) ofera o perspectiva mai buna (Figura 5 si 6) in ceea ce priveste acoperirea nanocristalelor oxid de titan de siliciu in stare amorfa. In acest sens, a fost realizata o sectiune cu un fascicul de ioni. Prin efectuarea sectiunii transversale s-a dovedit ca microsferele nu sunt goale in interior, spre deosebire de microsferele alumino-silicatice raportate in prealabil de grupul nostru [24].



Figura 5. Imagini SEM (la unghiuri diferite) ale microsferelor preparate, apartinand probei L0. Sectiunea transversala realizata cu fasciculul de ioni de galiu (A = muchie, B = sectiune).



Figura 6. Imagini SEM (la unghiuri diferite) ale microsferelor apartinand probei L0, tratata termic la 1100° C. Sectiunea transversala realizata cu fasciculul de ioni de galiu (A = muchie, B = sectiune).

In Figura 7 sunt prezentate la diferite magnificatii imaginile SEM ale probelor L0, L1, L5 si L10, tratate termic la 1100°C. Se pot observa nanocristalele dezvoltate pe surafata microsferelor, in concordanta cu difractogramele de raze X prezentate anterior.



Tabel 3. Atribuirea benzilor deasorbtie ale probelor inainte si dupatratamentul termic

Nr. de unda(cm ⁻¹)	Atribuire
1650	HOH
1597	C=C
1509, 1406, 1382	C-O, CO ₂
1046	CH ₃
939	C-C
1080, 950	Ti-O-Si
800-650	Ti-O-Ti (Rutil)
640, 525, 470, 410	La-O, La_2O_3
884, 845, 532, 476	Si-O-Si

Figura 7. Imagini SEM ale probelor L0, L1, L5 si L10 tratate termic la 1100°C (a, b – diferite magnificatii).

2.4 FTIR

Spectrele FTIR inregistrate pe probele L0 si L10 sunt prezentate in Figura 8, iar atribuirile benzilor de absortie se regasesc in Tabelul 3.



2.5 Raman

In cazul tratamentelor termice la 350, 600, 700 and 800°C benzile Raman sunt acoperite de semnalul de fluorescenta, putand fi evidentiate numai benzile D si G specifice carbonului (Figura 10).

In cazul probei L1, prezentata in acest rezumat ca si exemplu, se observa in caul tratamentelor termice de 900°C, benzi la numerele de unda 150, 400, 525 si respectiv 645cm⁻¹ asociate fazei de anatas. Odata cu cresterea temperaturii de tratament termic pana la 1100°C se observa ocrestere in intensitatea a benzilor Raman corespunzatoare fazei anatase, iar in cazul tratamentului la 1200°C apar doar benzile specifice rutilului, in concordanta cu rezultatele obtinute prin irfactie de raze X. De remarcat este prezenta anatasului la temperatura de 1100°C.



Figura 9. Spectrele Raman ale proei L1.

Figura 10. Spectrele Raman ale probelor L0, L1, L5 si L10 tratate termic la 350° C. Insertul reprezinta un exemplu de tratament termic la 600° C – L5.

2.6 EPR

Doparea cu gadoliniu a permis utilizarea ionior Gd^{3+} , ca centre de rezonanta paramagnetica sensibili la mediul lor inconjurator si capabili de a da informtii cu privire la modificarile structurale survenite in vecinatatea acestora datorita schimbarilor care au loc in compozitia matricii si in gradul de cristalinitate [25-28]. Ionii de Gd^{3+} introdusi in concentratii mici in matricea de sticla prezinta, de obicei, trei semnale tipice cu valori ale factorului giromgnetic la g ~ 5.9, 2.8 si 2.0 (spectrul in "U"), specific matricilor policristaline dezordonate care contin ioni de Gd^{3+} destul de omogen distribuiti [25,26,29,30]. Spectrele

microsferelor netratate termic sunt dominate astfel de o linie larga centrata la g ~2.0 care reflecta o vecinatate relaxata in matricea amorfa, dar se observa si linii mici la ~ 5.9 and 2.8. Acestea indica faptul ca exista pozitii in matricea amorfa unde ionii de Gd^{3+} se afla in camp intermediar. Largimea liniei de la g ~ 2.0 din spectrele EPR, care reflecta in mod direct schimbarile in rata de relaxare spin-retea si cel mai important in dinamica medie a anizotropiei factorului g, se modifica in intervalul de temperatura investigat. Linia larga de la g ~ 2.0 din spectrele probelor tratate termic la 350, 700 and 900°C ne indica ca ionii de Gd^{3+} sunt preponderent dispusi in faza reziduala necristalina, in camp cristalin slab, rezultat in urma relaxarii structurale dar inca cu un grad mare de dezordine in jurul lor.

Schimbarile structurale induse de tratamentul termic in probele titanosilicatice amorfe sunt bine reflectate in spectrele EPR ale probelor partial cristaline (Figura 11). Spectrele EPR indica faptul ca procesul de tratament termic joaca un rol important in formarea de centrii paramagnetici aditionali.

Spectrele EPR pentru microsferele tratate termic in intervalul sunt caracterizate printrun semnal ingust, suprapus peste componenta spectrala, la g – 2.004. In conformitate cu literatura [31] aceste linii sunt atribuite vacantelor de oxigen la titan (V_{Ti}) cu spin electronic neimperecheat. Acest semnal nu se regaseste in cazul probei L10, lantanul inhiband formarea de vacante de oxgen. Semnal EPR similar cu cel din jurul valorii g ~ 2.004 a fost observat si descris in literatura in cazul anatasului dopat cu C-dopat [32], TiO₂ dopat dopat cu B [33] sau TiO₂ dopat cu N [34]. Semnalul de la semnalul g = 2.003 - 2.005 a fost de asemenea atribuit in literatura de specialitate [35] unui electron captat la o vacanta de oxigen.

Spectrele EPR prezinta o usoara asimetrie a liniei de rezonanta (se abat de la o functie pur Lorentziana) care poate fi explicata prin prezenta unei anizotropii usoare si/sau a unui fundal de rezonanta relativ larg de o foarte joasa amplitudine. Largimea liniei spectrelor EPR, care reflecta in mod direct schimbarile in rata de relaxare spin-retea si cel mai important in dinamica medie a anizotropiei factorului g, se modifica in intervalul de temperatura investigat.

Din difractogramele de raze X se evidentiaza fazele cristaline care se devolta odata cu tratamentele termice (Figura 3). Integrarea ionilor de Gd^{3+} in aceste faze este observata in spectrele EPR.

Analiza spectrele EPR de la tratamente termice ridicate se complica datorita multitudinii de faze dezvoltate la aceaste temperaturi. In cazul tratamentelor termice la 1100 si 1200°C ionii de Gd^{3+} sunt integrati in faza $La_xTi_yO_z$, atat pentru sistemele L5 cat si L10 (Figura 11).



Figura 11. Spectrele EPR ale probelor L0, L1, L5 si L10 inainte si dupa tratamentele termice.

2.7 NMR

Analizele MAS-NMR efectuate pe nucleul de ²⁹Si luand in considerare cele patru stari de coordnare ale tertaedrului SiO₄ legate in reteaua sticlei oxidice. Potrivit Q⁽ⁿ⁾ notatiei, unde $n \le 4$ reprezinta numarul oxigenilor legati, valorile deplasarilor chimice reprezinta prezenta anumitor unitati SiO₄ [36]. Distributia tetraedrelor SiO₄ este estimata din deconvolutia spectrelor NMR realizata cu ajutorul programului DmFit program [37].

Spectrele ²⁹Si MAS NMR ale probelor L0, L1, L5 and L10 (Figura 12) obtinute prin metoda sol-gel indica prezenta majoritara a unitatilor Q^4 , Q^3 , Q^2 , Q^1 si Q^0 . Rezultatele deconvolutiilor realizate pe aceste spectre sunt prezentate in Tabelul 4. Figura 13 este un exemplu de deconvolutie a spectrului NMR in cazul probei L5.

Din deplasarea chimica a unitatilor Q^n (Tabelul 4 si Figura 12) se poate observa o usoara deplasare spre valori ppm mai mari, ceea ce indica o structurare a acestor unitati in matricea amorfa, odata cu cresterea continutului de lantan.

Ponderea unitatilor Qⁿ si largimea liniilor corespunzatoare au fost calculate (Tabelul 4) si reprezentate in Figura12 pentru L0, L1, L5 si L10 preparate prin metoda sol gel. Din aceste date se poate concluziona faptul ca proba L0 prezinta cel mai inalt grad de dezordine structurala, in timp ce proba L1 este cea mai ordonata din punct de vedere structural.



Figura 12. Spectrele ²⁹Si NMR ale probelor L0, L1, L5 si L10 preparate prin metoda sol gel.



Figura 13. Deconvolutia spectrului ²⁹Si NMR a probei L5 preparata prin metoda sol gel.

Tabel 4. Deplasarea chimica (A), fractiile relative (B) si largimea la semiinaltime ale unitatilor Qn pentru probele L0, L1, L5 si L10 preparate prin metoda sol gel.

Q ⁿ (ppm) X (% La)	Q ⁰	Q ¹	Q^2	Q ³	\mathbf{Q}^{4}	$Q^{n}(\%)$ X (% La)	Q ⁰	Q ¹	Q ²	Q ³	Q ⁴
0	-75	-81.28	-89.99	-101	-		6.09	10.11	61.0	21	
1	-70.82	-82.05	-91.12	-99.64	-	0	0.98	10.11	01.9	21	-
5	-75	-837	-923	-101	_	1	14.51	36.32	31.22	17.95	-
5	7.5	03.1	2.5	101	100.10	5	7.04	21.91	34.06	367	_
10	-72.93	-82.1	-92.6	-	-109.13	5	7.04	21.71	54.00	50.7	
	•	•	-	-		10	6.81	9.89	71.13	-	12.16

Q ⁿ (ppm) X (% La)	Q ⁰	Q ¹	Q^2	Q ³	Q^4
0	-75	-81.28	-89.99	-101	-
1	-70.82	-82.05	-91.12	-99.64	-
5	-75	-83.7	-92.3	-101	-
10	-72.93	-82.1	-92.6	-	-109.13

2.8 XPS

Spectrele XPS obtinute pentru probele L0 si L5 indica prezenta oxigenului si a carbonului, impreuna cu titanul, siliciul si lantanul (L5), dupa cum se poate observa si din Figurile 14, 15 si Tabelul 5. Au fost inregistrate de asemenea spectrele de inalta rezolutie corespunzatoare Si 2p (110-90eV), Ti 2p (470-450eV), La 3d (870-820eV), O 1s (545-520eV) si C 1s (295-270eV), prezentate in detaliu in cadrul tezei.

Aparitia C in spectrele XPS se datoreaza moleculelor organice care nu au fost in totalitate eliminate de la suprafata microsferelor in procesul de uscare prin pulverizare, cat si adsorbtiei acestuia pe suprafata probelor expuse la mediul inconjurator, dar intr-o masura mai mica [38].



Figura 14. Spectrele XPS ale probei L0.

Figura 15. Spectrele XPS ale probei L5.

In Tabelul 5 se observa o scadere a concentratiei de carbon la supratafa probelor odata cu cresterea tratamentului termic, ca urmare a eliminarii acestor componente organice. Compozitia procentuala relativa a principalelor elemente in cazul probelor L0 si L5 inainte si dupa tratamente termice estimata din spectrele XPS indica o scadere a concentratiei de titan la suprafata odata cu cresterea temperaturii de tratament termic, in timp ce siliciul creste procentual la suprafata. concluzionand faptul ca suprafata microsferelor este acoperita de un strat de dioxid de siliciu. Aceste rezultate coroborate cu cele de difractie de raze X indica faptul ca microsferele tratate termic prezinta la suprafata de un strat subtire de oxid de siliciu in stare amorfa.

Tabel 5. Compozitia procentuala relativa a principalelor elemente, estimata din spectreleXPS, in cazul probelor L0 si L5 inainte si dupa tratamente termice.

T(°C)	Elen	Ti/Si T(°C)		Ele	ementa (at.)	l com %) –	iposit L5	ion	Ti/Si				
	0	С	Ti	Si				0	С	La	Ti	Si	
as- prepared	50.2	30.3	9.3	10.2	0.91		as- prepared	43	42.6	1.3	5.7	7.4	0.77
350 °C	50.1	21.7	10.9	17.3	0.63		350 °C	49	32.3	1.7	8.5	8.5	1
700 °C	50.1	19.6	10.2	20.1	0.5		700 °C	51.4	27.6	1.6	8.4	11	0.76
900 °C	49	22.3	7.5	21.2	0.35		900 °C	70.2	13.2	1.4	3.4	11.8	0.28
1100 °C	52.4	8.4	2.3	36.9	0.06		1100 °C	62.2	7.8	0.9	3.4	25.7	0.13

3. Microsfere titanosilicatice nanostructurate, cu continut scazut de lantan

(50-x)%TiO₂·(50-x)SiO₂·xLa₂O₃ (x = 15, 20, 50) – notate in continuare *L15*, *L20 si L50* **3.1 XRD**

Difractogramele probelor L15, L20 si L50 (Figura 16) evidentiaza prezenta diferitelor nanocritale dezvoltate odata cu aplicarea tratamentelor termice. Singura faza cristalina dezvoltata in intervalul de temperatura $350-600^{\circ}$ C pentru probele L15 si L20 este La₂CO₅ (23-0320). Din difractograma probei L50 se observa un caracter predominant amorf pana la temperatura de tratament termic de 650°C, temperatura de la care incepe procesul de nucleatie al fazei cristaline La₂CO₅.

Odata cu cresterea temperaturii de sinterizare se dezvolta o noua faza cristalina, La_2O_3 (05-0602), ca urmare a descompunerii $La_2O_2CO_3$, in concordanta cu analizele temice:

$$La_2O_2CO_3 \rightarrow La_2O_3 + CO_2$$

Temperatura de tranzitie de la faza cristalina La_2CO_5 la La_2O_3 creste proportional cu concentratia de oxid de lantan introdus in matrice. Datorita nerezolvarii corespunzatoare a fazelor cristaline in cazul probei L50 tratata la 700°C s-au aplicat doua tratamente termice intermediare si anume: 650 respectiv 730°C.

Daca tranzitia $La_2CO_5 \rightarrow La_2O_3$ a fost finalizat la 700°C pentru primele doua sisteme (L15 si L20), difractogramele XRD pentru cea de-a treia proba (L50), arata faptul ca aceste faze (La₂CO₅, La₂O₃) coexista la aceasta temperatura, tranzitia completandu-se la 730°C [39].

Faza cristalina La₂O₃ dezvoltata la 700°C pentru probele L15 si L20 se mentine pana la 1000°C respectiv 1200°C. Dupa temperatura de 700°C, in cazul probei L15, pe langa aceasta faza cristalina se dezvolta nanocristale de rutil, mentinandu-se pana la 1200°C. Faza de rutil poate fi observata pentru proba L20 in intervalul de temperatura 800°C - 1200°C. De mentionat ese faptul ca nanocristale de rutil nu se dezvolta in cazul probei L50. In cazul probelor L15 si L20, odata cu cresterea tratamentului termic la 1000°C se dezvolta nanocristale de La₂Ti₂O₇, cat si SiO₂ (coesit). Odata cu cresretea tratamentului termic la 1100°C si 1200°C se observa o vrestere a nanocristalelor La_xTi_yO_z alaturi de cele specifice coesitului.

In intervalul de temperatura $800 - 1200^{\circ}$ C se dezvolta in cazul probei L50 nanocristale de: La_{9.33}Si₆O₂₆ –faza tip apatita (49-0443), La₂TiO₅ (15-0335) si SiO₂ (coesit). Cresterea temperaturii de tratament in acest interval de temperatura duce la crestere nanocristalelor specifice acestor faze. Temperatura de cristalizare a fazei apatitice este mai scazuta decat cea obtinuta in cazul prepararii prin reactie din faza solida si raportata in literatura (1500°C) [40,41].



Figura 16. Difractogramele XRD ale probelor L15, L20 si L50.

3.2 SEM

Au fost inregistrate imaginile SEM ale probelor preparate prin metoda sol gel si uscare prin pulverizare, din care se observa obtinerea de microsfere in cazul probei L15 si de microparticule pentru probele L20 si L50 (Figura 17). In cazul microsferelor L10 se observa faptul ca peretii sunt deformati din cauza ciocnirilor dintre microsfere in timpul uscarii prin pulverizare, cat si datorita coliziunii microsferelor cu peretii ciclonului. Se observa o deformare mai acentuata a peretilor microsferelor L15 decat in cazul probei L10. Odata cu aplicarea tratamentului termic forma sferica nu mai este bine definita si se observa o aglomerare de microparticule (Figura 18). Prin cresterea tratament termic pentru proba cea mai mare concentratie de lantan (L50), dimensiunea particulelor apar diminuate datorita atat datorita indepartarii apei, a moleculelor organice ramase in probe prin uscarea prin pulverizare, cat si datorita densificarii si schimbarilor structurale [42]. Microparticulele diminuate duc la formarea de aglomerari, cu grad ridicat de porozitate.



Figura 17. Imagini SEM ale prpbelor L15, L20 si L50 preparate prin metoda sol gel.



Figura 18. Imagini SEM ale probei L15 la diferite tratament termice si magnificari (a, b).



Figura 19. Imagini SEM ale probei L50 la diferite tratamente termice si magnificari (a, b, c, d, e, f, g).



Figura 20. Spectrele FTIR ale probelor L15, L20 si L50.

Spectrele FTIR ale proelor L15, L20 si L50 sunt prezentate in Figura 20, iar atribuirea benzilor se regaseste in Tabelele 6-8.

 Tabel 6. Atribuirile benzilor de absotbtie ale probelor L15 si L20 preparate prin metoda sol gel inainte si dupa tratamentele termice la 350, 600 si 700°C.

T(°C)		A tribuino	Fara		
preparate	350°C	600°C	700°C	Autoure	гаzа
1622				HOH band	
1455 ,1340	1523,1360	1523,1360,1460	1500,1364,2344	CO_{3}^{2}	La_2CO_5
826	850	850		CO_3^{2-} , Si-O	La_2CO_5
	662	662	662	OCO	La_2CO_5
	518	518		CO_2	La_2CO_5

Tabel 7.	Atribuirile benzilor de absotbtie ale probelor L15 si L20 dupa tratamentele termice
	la 800, 900, 1000 si 1100°C.

Т	(°C)	Numar de	unda (cm ⁻¹)	A tribuing	Fozo
800°C	900°C	1000°C	1100°C	Autoure	гаzа
475	1105,475	1105	1114	La-O	La_2O_3
		950-1065	950-1065	La-O-Si	
		842-884	842-884	Si-O ⁻	SiO ₂
		760,650,556,492,466,420	760,650,556,492,466,420		La _x Ti _y O _z

T(°C)		Nı	umar de unda	A 4	Бала	
preparate	350	0°C	650°C	730°C	Atribuire	raza
1638	16	538	1638	1631	HOH band	
1455 ,1340	1485	,1386	1485,1378	1485,1378	$CO_3^{2-}(1)$	La_2CO_5
835	8	89	889	858	$CO_3^{2-}(3)$	La_2CO_5
				$491, 639 \text{ cm}^{-1}$	La-O	La_2O_3

Tabel 8. Atribuirile benzilor de absotbtie ale probei L50 preparata prin metoda sol gel inaintesi dupa tratamentele termice la 350, 650 si 730°C.

Tabel 9. Atribuirile benzilor de absorbtie ale probei L50 dupa tratamentele termice la 800, 900, 1000 si 1100°C

T(°C)		Numar de u	ında (cm ⁻¹)	A 4 millioning	Fore	
800°C	900°C	1000°C	1100°C	Atribuire	Faza	
1634				H ₂ O		
913-521	913-521	913-532	913-524		La9.33Si6O26	
958	958	958	958	La-O-Si		
		852-983	852-983	Si-O ⁻	SiO ₂	

3.4 Raman

Benzile Raman observate in jurul valorilor de 240, 355, 758 si 840 cm⁻¹ (Figura 21) se pot atribui fazei de tip apatita, $La_{9,33}Si_6O_{26}$, rezultate in buna concordanta cu spectrele Raman ale acestei faze raportate in literatura [43]. Dupa tratamentul termic la 800°C se observa o crestere in intensitate ale acestor benzi, o corelatie buna existand cu difractogramele XRD prezentate anterior.



Tabel 10. Atribuirile benzilor Ramanpentru proba L50.

Nr. de unda (cm ⁻¹)	Atribuire benzi		
1070	La_2CO_5		
310, 355, 445	La_2O_3		
240, 270, 355, 375, 840	$La_{9.33}Si_6O_{26}$		
90, 780	La_2TiO_5		
125, 206, 390, 510	SiO ₂		
935	Si-O-Ti		
800	Si-O-Si		
755	Si-O and O-Si- O		
705	Ti-O-Ti		
605	Si-O		

Figura 21. Spectrele Raman ale probei L50.

In spectrele Raman ale probei L50 pot fi observate benzi in jurul valorilor 840 si 390 cm⁻¹, specifice vibratiei simetrice de intindere a unitatii SiO₄ [44]. Benzile Raman de la numerele de unda at 125, 206, 390 si 510 cm⁻¹ indica prezenta coesitului (SiO₂), iar cea de la 520 cm⁻¹ este asociata cu vibratia antisimetrica de rasucire a tetraedrelor SiO₄, observandu-se totodata o crestere in intensitate odata cu tratamentele termice aplicate. Aparitia acestei benzi se datoreaza proprietatii ionilor de lantan de a depolimeriza reteaua de oxid de siliciu [45]. L numere de unda mai mari, spectrele Raman inregistrate pe proba tratata termic la 350, 600 si 700°C prezinta o banda intensa (1070 cm⁻¹) specifica carbonatului de lantan [46,47], in buna concordanta cu rezultatele XRD.

3.5 EPR

Spectrele EPR ale probelor L15, L20 si L50 prezinta spectru U caracteristic ionilor de Gd^{3+} , descris anterior in cazul probelor cu continut scazut de lantan. Pentru tratamentele termice la 1100°C si respectiv 1200°C se observa faptul ca lantanul inhiba formarea vacantelor de oxigen. Din difractogramele de raze X ale probelor L15, L20 si L50 se observa prezenta fazelor cristaline care se dezvolta odata cu tratamentele termice aplicate, spectrele EPR indicand integrarea ionilor de Gd^{3+} in aceste faze. Razelor ionice specifice ionilor de Gd^{3+} , Ti⁴⁺, Si⁴⁺ si La³⁺ sunt 0.93, 0.68, 0.5 si respectiv 1.06Å. Ionii de Gd^{3+} pot fi astfel integrati in faza cristalina La₂Ti₂O₇ dezvoltata in probele L15 si L20 tratate termic la 1000°C. Pe baza valorilor apropiate ale razelor ionice in cazul ionilor de Gd^{3+} si La³⁺ putem concluziona integrarea ionii de Gd^{3+} in faza La_xTi_yO_z (Figura 22). In cazul probei L50 ionii de Gd^{3+} sunt integrati in faza de tip apatita, dezvoltata dupa tratamentul termic de 800°C.

Este cunoscut [48] faptul ca La_2O_3 complet decarbonatat poate genera ioni paramagnetici in jurul valorii de g ~ 2.000±0.001detectabili de tehnica EPR. De asemenea a fost demonstrat faptul ca in materialele izolatoare, la temperatura ridicata, pot fi captati electroni si goluri, formandu-se centrii O⁻ si O₂⁻ [49]. Specrul EPR al O²⁻ pentru La₂O₃ prezinta un semnal paramagnetic la g ~ 2.006, semnal care se pote regasi si la o valoare cu 0.003 mai mare, variatie care poate aparea din cauza dificultatilor intampinate la eliminarea impuritatilor de carbon de la suprafata [50]. Semnalele EPR prezente in probele L15, L20 si L50 in cazul tratamentelor termice din intervalele 700 - 1000°C (L15) si respectiv 700 -1200°C (L20, L50) (spectrele marcate cu rosu) pot fi astfel atribuite acestor fenomene.



Figura 22. Spectrele EPR ale probelor L15, L20 si L50.

3.6 NMR

Au fost inregistrate spectrale ²⁹Si MAS-NMR ale probelor L15 si L50 (Figura 23) preparate prin metoda sol gel si efectuate dconvolutii in vederea estimarii valorilor corespunzatoare deplasarii chimice pentru unitatile $Q^{(n)}$, in scopul de a evalua distributia tertaedrelor SiO₄. Astfel este identificata prezenta



Figure 23. Spectrele ²⁹Si NMR ale probelor L0, L1, L5 si L10 preparate prin metoda sol gel.

unitatilor Q^4 , Q^2 , Q^1 si Q^0 , regasite si in probele cu continut scazut de lantan. Deplasarea chimica (A), fractiile relative (B) si largimea la semiinaltime ale unitatilor Q^n pentru probelor

L15 si L50 preparate prin metoda sol gel sunt prezentate in Tabelul 11. Se poate observa faptul ca proba L50 prezinta cel mai ridicat grad de deordine structurala.

unitation Q pendiu probeior LTS si LSO p					Ы	eparate prin	I meto	ua soi g	el.	
Q ⁿ (ppm) X (% La)	Q ⁰	Q ¹	Q^2	Q^4		Q^{n} (%) X (% La)	Q ⁰	Q ¹	Q^2	Q ⁴
15	-75.87	-86.33	-97.96	-110		15	3.53	16.87	63.28	16.32
50	-75.87	-85.5	-94.84	-109.34		50	1.75	17.23	78.3	2.73

Tabel 11. Deplasarea chimica (A), fractiile relative (B) si largimea la semiinaltime ale unitatilor Qⁿ pentru probelor L15 si L50 preparate prin metoda sol gel.

Q ⁿ (ppm) X (% La)	Q^0	Q ¹	Q^2	Q^4
15	7.51	12.54	19.06	21.36
50	13.81	18.1	23.28	9.31

3.7 XPS

Dezvoltarea fazelor cristaline pe suprafata probelor are o importanta deosebita in cazul aplicatiilor catalitice. *L15:* Din compozitia procentuala relativa a principalelor elemente, estimata din spectrele XPS, in cazul probei L15 inainte si dupa tratamente termice (Tabelul 11) se poate observa o crestere a lantanului la suprafata microsferelor odata cu cresterea tratamentului termic. In cazul tratamentului termic la 350° C se observa la suprafata microsferelor numai prezenta lantanului, oxigenului si carbonului, procentul atomic al acestor elemente fiind comparabil cu cel calculat in cazul fazei La₂CO₅. Coreland aceste rezultate cu cele XRD, unde se observa numai prezenta acestei faze la 350° C, putem concluziona faptul ca nanocristalele La₂CO₅ sunt predominante la suprafata. Acest rezultat este important in aplicatii catalitice. Concentratia carbonului la suprafata scade datorita descompunerii atat rezidurilor organice din precursori cat si fazei La₂CO₅.



Figura 24. Spectrele XPS ale probei L15.

Tabel 12. Compozitia procentuala relativa a principalelor elemente, estimata din spectrele XPS, in cazul probei L15 inainte si dupa tratamente termice.

T(°C)	Co					
	0	С	La	Ti	Si	Ti/Si
prep.	42.82	50.98	2.59	3.61	-	-
350	63.2	20.4	16.4	-	-	-
700	62.43	21.33	15.8	0.44	-	-
900	63.9	14.19	19.42	2.49	-	-
1100	47.72	27.71	7.47	9.9	7.2	1.37

L50: Din spectrele XPS ale probei L50 preparata prin metoda sol gel se observa prezenta N 1s. In Tabelul 19 este prezentata compozitia procentuala relativa a principalelor elemente, estimata din spectrele XPS, in cazul probei L50 inainte si dupa tratamente termice. Valorile electronegativitatii in cazul Ti si La fiind 1.5 si respectiv 1.1 [51,52], posibilitatea transferului de electroni de la La la Ti este favorabila in cazul legaturilor Ti-O-La.



Figura 25. Spectrele XPS ale probei L50.

Tabel 13. Compozitia procentuala relativa a principalelor elemente, estimata din spectrele XPS, in cazul probei L50 inainte si dupa tratamente termice.

T(⁰ C)	Co					
I(C)	0	С	La	Si	Ti	Ti/Si
Prep.	50.7	38.8	4.9	4.3	1.3	0.3
350	53.64	22.05	15.68	5.43	3.2	0.59
700	62 99	14.69	21.71	-	0.61	-
900	58.18	13.55	21.33	4.10	2.84	0.69
1100	55.68	12.72	22.45	6.11	3.04	0.49

Concluzii

Au fost sintetizate prin metoda sol gel combinata cu uscarea prin pulverizare microsfere (L0-L15), respectiv microparticule (L20, L50) cu caracter amorf si diametru mai mic de 5 µm. In timpul sintezei pH-ul a fost ajustat la o valoare corespunzatoare pentru a stabiliza solutia inainte de pulverizare. Din punct de vedere al fabricarii, uscarea prin pulverizare ofera avantajul de a fi un proces cu un numar de pasi considerabil redus comparativ cu metoda clasica. Folosind aceasta tehnica numarul de operatii se reduce, este imbunatatita eficienta productiei si se obtine o reducere a costurilor, tehnica putand fi usor automatizata pentru produse de linie. Cresterea continutului de lantan in matrice duce la cresterea indicelui de refractie al microsferelor, respectiv al microparticulelor obtinute.

Microsferele sintetizate s-au dovedit a fi necristaline, fapt confirmat de difractia de raze X. Analizele DTA au pus in evidenta temperaturile la care se pierde apa si se descompun componentele organice, respectiv la care procesul de cristalizare este maxim. Prin difractie de raze X, au fost identificate fazele cristaline (anatas, rutil, SiO₂, La₂O₃, La₂Ti₂O₇, La₂TiO₅, La₄Ti₉O₂₄ cat si o faza tip apatita, La_{9.33}Si₆O₂₆) formate in microsferele polictistaline obtinute dupa tratamentele termice, cat si faptul ca introducerea lantanului in matrice favorizeaza formarea nanocristalitelor de dimensiuni mai mici, fenomen important in procesul de cataliza. Prezenta fazei de tip apatita La_{9.33}Si₆O₂₆ in probele cu un continut ridicat de lantan face ca aceste materiale sa aiba aplicabilitate in domeniul pilelor de combustie, senzorilor de oxigen sau membrane separatoare.

Pentru probele cu concentratie de 20% si mai ales pentru 15% continut de La_2O_3 , nanocristalele predominante dezvoltate in urma tratamentelor termice sunt specifice unei structuri policlor, $La_2Ti_2O_7$, o faza intens investigata in literatura de specialitate pentru potentiale aplicatii tehnologice.

Doparea cu gadoliniu a permis utilizarea ionior Gd^{3+} , ca centre de rezonanta paramagnetica sensibili la mediul lor inconjurator si capabili de a da informtii cu privire la modificarile structurale survenite in vecinatatea acestora datorita schimbarilor care au loc in compozitia matricii si in gradul de cristalinitate. Modificarile ordinii locale din jurul ionilor de Gd^{3+} sugereaza integrarea acestor ioni in fazele nanocristaline dezvoltate dupa tratamentele termice, substituind lantanul din aceste faze.

S-a dovedit faptul ca o concentratie de 1% oxid de lantan duce la obtinerea de microsfere cu un ridicat caracter amorf (²⁹Si MAS-NMR), comparativ cu restul concentratiilor investigate, cat si la mentinerea nanocristalelor specifice anatasului la temperaturi de pana la 1100°C, prezenta acestui fapt fiind evidentiat de analizele de didractie de raze X si comfirmat prin spectroscopie Raman.

Pentru probele cu continut de scazut lantan analizele XPS subliniaza faptul ca microsferele tratate termic au suprafete bogate in oxid siliciu, in timp ce titanul domina in interior. Aceste rezultate, completate de cele XRD, SEM si EDX sustin ideea ca suprafetele microsferelor tratate termic sunt si raman acoperite dupa tratamentele termice de un strat de siliciu in stare amorfa.

Microsferele tratate termic prezinta astfel o suprafata mai prietenoasa pentru interactiuni viitoare cu medii biologice, permitandu-le o mai buna integrare in tesutul nativ.

Pentru o concentratie mai mare de oxid de lantan (15-50%) se dezvolta la suprafata probelor nanocristale specifice fazei La_2CO_5 , un rezultat important in aplicatiile catalitice. Odata cu cresterea concentratiei de oxid de lantan in matrice se observa o crestere a temperaturii de tranzitie de la La_2CO_5 la La_2O_3 .

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA:

[1] J. Yu, J. C. Yu and X. Zhao, J. Sol-Gel Sci. Tech. 24, (2002), 95.

[2] S. Hong, M. S. Lee, S. Park and G. Lee, Catal. Today 87, (2003), 99.

[3] A. Nilchi, S. Janitabar-Darzi, S. Rasouli-Garmarodi, Materials Sciences and Applications, (2011) 2, 476-480.

[4] Mohamed,I.A.Mkhalid, Journal of Alloys and Compounds,volume 501, pages 143-147(2010).

[5] K.T. Ranjit, I. Willner, S.H. Bossmann, A.M. Braun, Lanthanide oxide-doped titanium dioxide photocatalysts: novel photocatalysts for the enhanced degradation of *p*-Chlorophenoxyacetic acid, Environ. Sci. Technol. 35 (2001)1544.

[6] Zhang, H.X. Zhang, Y.X.Xu, Y.G.Wang, Europium doped nanocrystalline titanium dioxide: preparation phase transformation and photocatalytic properties, J. Mater. Chem. 13 (2003) 2261.

[7] Gao; Wachs, I.E.Catal.Today 1999, 51, 223.

[8] Y. Zang, Y. Wu, M. Chen, L. Wu, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 353 (2010) 216-225.

[9] W. Dong, C.W. Lee, X. Lu, Y. Sun, W. Hua, G. Zhuang, S. Zhang, J. Chen, H. Hou, D. Zhao, Appl. Catal. B-Environ. 95 (2010) 197-207.

[10] H. Nur, Mater. Sci. Eng., B 133, 1-3 (2006) 49-54

- [11] M.S. Dadash, S. Karbasi, M.N. Esfahani, M.R. Ebrahimi, H. Vali, J. Mater. Sci. Mater. Med. 22 (2011) 829–838.
- [12] Shibli, S. Mathai, J. Mater. Sci. Mater. Med. 19 (2008) 2971–2981.

[13] V. Ääritalo, S. Areva, M. Jokinen, M. Lindén, T. Peltola , J. Mater. Sci. Mater. Med. 18 (2007)1863-1873.

- [14] Areva, V. Aäritalo, S. Tuusa, M. Jokinen, M. Lindén, T. Peltola, J. Mater. Sci. Mater. Med. 18 (2007) 1633–1642.
- [15] A.M. Seco, M.C. Gonçalves, M.R. Almeida, Mater. Sci. Eng., B 76 (2000) 193–199.

[16] O. Ponta, E. Vanea, A. Cheniti, P. Berce, S. Simon, Materials Chemistry and Physics,

Volume 135, Issues 2–3, 15 August 2012, Pages 863–869.

[17] Kapoor, J. Cell. Biochem. (2009) 106, 193.

[18] Feng, H. Xiao, X. He, Z. Li, F. Li, N. Liu, Y. Zhao, Y. Huang, Z. Zhang, Z. Chai, Toxicol. Lett. (2006) 165, 112.

[19] Fei, L. Yuanlei, W. Yang, X. An, L. Guohui, J. Rare Earths 25 (2007) 359.

[20] Bernard, L. Anthony, A. Daniel, R. Nadya, M. Natalie, B.D. Tilman, Kidney Int. (2005)67, 1062.

[21] Paiva, M.S. de Oliveira, S.N. Yunes, L.G. de Oliveira, J.B. Cabral-Neto, C.E.B. de

Almeida, Bull. Environ. Contam. Toxicol. (2009) 82, 423.

[22] Guan, Y.-S. Yin, Mater. Chem. Phys. (2005) 92, 10.

[23] Nalt. Bur. Stand. (U.S.) Monogr. 25, 7, 82 (1969).

[24] M.Todea, R.V.F.Turcu, B.Frentiu, M.Tamasan, H.Mocuta, O.Ponta, S.Simon, J. Mol. Struct. 1000 (2011) 62–68.

[25] O. Ponta, H. Mocuta, M. Vasilescu, S.Simon, J Sol-Gel Sci Technol, 58 (2) (2011) 530-534.

[26] S. Simion, A.D. Udvar, J. Am. Ceram. Soc. 93, 2760 (2010) 1-4.

[27] S. Simon, R. Pop, V. Simon, M. Coldea, J. Non-Cryst. Solids, 331, 1 (2003).

[28] E.Culea, L.Pop, S. Simon, Mater. Sci. Eng. B 112:59 (2004).

[29] Hussain, Y. Prabhakara Reddy, S. Buddhudu, Mater. Res. Bull. 36 (2001) 1813.

[30] Kliava, A. Malakhovskii, I. Edelman, A. Potseluyko, E.A. Petrakovskaja, S. Melnikova,

T. Zarubina, G. Petrovskii, Y. Bruckental, Y. Yeshurun, Phys. Rev. B 71 (2005) 104406.

[32] Li, D.S. Hwang, N.H. Lee, S.J. Kim, Chem. Phys. Lett. 404 (2005) 25-29.

[33] Fittipaldi, V. Gombac, T. Montini, P. Fornasiero, M. Graziani, Inorg. Chim. Acta 361 (2008) 3980–3987.

[34] Feng, Y. Wang, Z. Jin, J. Zhang, S. Zhang, Z. Wu, Z. Zhang, New J. Chem. 32 (2008) 1038–1046.

[35] Kuznetsov, N. Serpone, J. Phys. Chem. C 113 (2009) 15110–15123.

[36] Zhang, P. J. Grandinetti, J. F. Stebbins, J. Phys. Chem. B 101 (1997) 4004.

[37] Massiot, F. Fayon, M. Kapron, I. King, S. Le Calve, B. Alonso, J.-O. Durand, B. Bujoli,

Z. Gan, G. Hoatson, Magn. Reson. Chem. 40 (2002) 70.

[38] Sheng ,CAI Wei-ping, WAN Li-xi, SHI Ming-da, LUO Xiang-dong, JING Wei-ping Trans nonferrous Met. Soc. China 19(2009) s743-s747.

[39]Carlos Vazquez-Vasques, M.Arturo Lopez-Quintela, Journal of solid state Chemistry 179(2006) 3229-3237.

[40] Célérier, C. Lberty, F Asart, P. Lenormand, P. Stevens, Ceram. Int. 32(2006) 271.

[41] Nakayama, M. Higuchi, J. Mater.Sci.Lett.2001, 20, 913.

[42] A. Cheniti, O.Ponta, L.Tarle, T. Radu, S. Simon, Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications Vol. 6, No. 5-6, May - June 2012, p. 560 – 563 [43] Reyna, A. F. Fyents, M. Mczka, J. Hanuza, K. Boulahya, U. Amador, J. Solid State Chem.197 (2006) 522.

[44] Lucazeau, N. Sergent, T. Pagnier, A, Shaula, V. Kharton, F.M.B. Marques, J. Raman Spectrosc. 38 (2007) 21.

[45] Kepinski, Woldzimierz Mista, Janina Okal, Marek Drozd, Miroslaw Maczka, Silid State Sciences 7 (2005) 1300-1311.

[46] Vieira, J.C Oliveira, A.L.Shaula, A.Cavaleiro, B.Trindade; Surafce Coatings Technology 206 (2012) 3316-3322.

[47] Klingenberg, M. A. Vannice, Chem. Mater.8 (1996) 2755.

[48] Louis, Tien Lin Chang, Maggy Kermace, Tiep Le Van Jean Michel Tatibouet and Lichel

che; Catalysis Today, 13 (1992) 283-289

[49] Wang and Jack H. Lunsford, J. Phys. Chem. 1986, 90, 3890-3891.

[50] Xiang, Jack H. Lunsford; J.Phys. Chem. 1986, 90, 3890-3891.

[51] Benjaram Reddy, Biswajit Chowdhury, Panagiotis G. Smirniotis, Applied Catalysis A: Generall.Volume 219(2001) 53-60.

[52] Lee, Concise Inorganic Chemistry, 4th Edition, p. 160.